

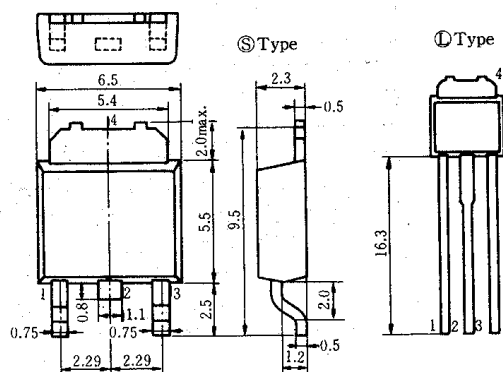
2SK429(L), 2SK429(S)

シリコン Nチャネル MOS FET

高速度電力スイッチング用

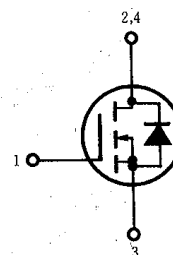
SILICON N-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING



(DPAK)

1. ゲート: Gate
 2. ドレイン: Drain
 3. ソース: Source
 4. ドレイン: Drain
- (Dimensions in mm)



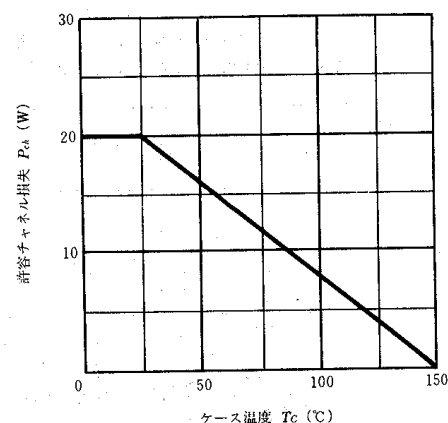
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SK429(L), 2SK429(S)	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}		100	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}		± 20	V
ドレイン電流	I_D		3	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(\text{peak})}$		6	A
逆ドレイン電流	I_{DR}		3	A
許容チャネル損失	P_{ch}		20	W
チャネル温度	T_{ch}		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		$-55 \sim \pm 150$	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DS}$		$I_D=10\text{mA}$, $V_{GS}=0$	100	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}		$V_{GS}=\pm 20\text{V}$, $V_{DS}=0$	—	—	± 1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}		$V_{DS}=80\text{V}$, $V_{GS}=0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(\text{off})}$		$I_D=1\text{mA}$, $V_{DS}=10\text{V}$	1.0	—	4.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(\text{on})}$		$I_D=2\text{A}$, $V_{GS}=15\text{V}$ *	—	0.5	0.7	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(\text{on})}$		$I_D=2\text{A}$, $V_{GS}=15\text{V}$ *	—	1.0	1.4	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $		$I_D=2\text{A}$, $V_{DS}=10\text{V}$ *	0.5	0.9	—	S
入力容量	C_{iss}		$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	—	280	—	pF
出力容量	C_{oss}			—	150	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}			—	24	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(\text{on})}$		$I_D=2\text{A}$, $V_{GS}=15\text{V}$ $R_L=15\Omega$	—	10	—	ns
立ち上がり時間	t_r			—	25	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(\text{off})}$			—	30	—	ns
下降時間	t_f			—	20	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}		$I_F=2\text{A}$, $V_{GS}=0$	—	0.8	—	V
逆回復時間	t_{rr}		$I_F=2\text{A}$, $V_{GS}=0$, $di_F/dt=50\text{A}/\mu\text{s}$	—	200	—	ns

* パルス測定

* Pulse Test